

Neues optisches Profilometer auf der Intersolar - FRT präsentierte budgetfreundlichen MicroSpy Profile

04.06.2009, 08:16 | Industrie, Bau & Immobilien

Pressemitteilung von: *FRT, Fries Research & Technology GmbH*

Presseagentur: *Alpha & Omega PR*



Neues budgetfreundliches optisches Profilometer FRT MicroSpy Profile

Fries Research & Technology (FRT), Spezialist für hochauflösende, zerstörungsfreie und automatisierte 3D-Oberflächenmesstechnik, zieht ein positives Intersolar-Fazit. "Wir sind zufrieden mit den Besucherzahlen. Das Interesse an leistungsstarken Messtechniklösungen für die Produktion von Solarzellen ist immens. In den vergangenen drei Jahren haben wir z.B. mit unseren Profilometern in der Solarbranche Zuwachsraten von 25 Prozent verbucht", verrät Geschäftsführer Dr. Thomas Fries. Auf der Intersolar präsentierte FRT das neue Profilometer MicroSpy Profile (<http://www.profilometer.com/de>) für den günstigen Einstieg in die optische Oberflächenmesstechnik.

Solarwafer präzise, schnell und zerstörungsfrei untersuchen

Der MicroSpy Profile, ein neues optisches Profilometer von FRT, ermöglicht den günstigen Einstieg in die berührungslose 2D- und 3D-Oberflächenmesstechnik. Der MicroSpy Profile ist als sehr leistungsfähiges und zugleich wirtschaftliches Oberflächenmessgerät konzipiert und für die optische scannende Messung von Rauheit, Kontur und 3D-Topographie an Solarwafern einsetzbar. Dank leistungstarker Sensortechnik liefert das FRT Profilometer Ergebnisse auf

fast allen Oberflächen und Materialien - präzise und schnell. Je nach Sensor-Ausstattung sind dabei Höhenmessbereiche zwischen 300 µm bis 3 mm und eine vertikale Auflösung von 3 nm erreichbar. Aufgrund des günstigen Einstiegspreises und der Vielseitigkeit des neuen Geräts sind die Einsatzgebiete und -möglichkeiten weit gefächert. In der Solarbranche wird das Oberflächenmessgerät zum Beispiel zur Charakterisierung der Güte von Kontaktstreifen (sog. Finger) auf einem monokristallinen oder multikristallinen Solarwafer, mittels derer der Strom abgeführt wird, eingesetzt.

Führende Solarwafer Hersteller wie die Q-Cells AG, REC ScanWafer oder Wacker Schott Solar setzen bereits auf optische Profilometer von FRT in Forschung und Entwicklung sowie in der begleitenden Produktionskontrolle. Damit sparen sie Material ein, erhöhen den Wirkungsgrad ihrer Produkte und eröffnen neue Möglichkeiten für die Qualitätskontrolle.

Informieren Sie sich über das neue Profilometer MicroSpy Profile: <http://www.profilometer.com/de>

Pressekontakt:

Portrait

Das Bergisch Gladbacher Unternehmen Fries Research & Technology GmbH (FRT) bietet Oberflächenmesstechnik von der Forschung bis zur Produktionskontrolle. Die innovativen Geräte vermessen berührungslos und zerstörungsfrei Topographie, Struktur, Stufenhöhe, Rauheit, Verschleiß, Schichtdicke etc. für Unternehmen aus den Branchen Automotive, Halbleiter, Mikrosystemtechnik, Optik, Solar/Photovoltaik und vielen anderen.

Das Unternehmen unterhält Tochtergesellschaften in den USA, China und der Schweiz, ein Vertriebs- und Servicenetz in den USA, Asien und Europa sowie eine Niederlassung in München. Zum Kundenkreis zählen namhafte Unternehmen wie Bayer, Bosch, Daimler oder Infineon.

News-ID: 314995 • Views: 141 (Stand: 11.08.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/314995/Neues-optisches-Profilometer-auf-der-Intersolar-FRT-praesentiert-budgetfreundlichen-MicroSpy-Profile.html>